



北京航空航天大学
电子信息工程学院

- 首页
- 学院简介
- 新闻动态
- 师资队伍
- 研究生之窗
- 本科生之窗
- 规章制度
- 党政党建
- 国际交流
- 校友之窗
- 联系我们



新闻动态

您当前位置: 首页 > 新闻动态 > 学院动态

- 全部新闻
- 学院动态
- 科研学术
- 人才培养
- 学生工作
- 党政党务
- 招生动态
- 就业信息
- 通知公告
- 国际交流
- 院网公告
- 工会工作

【学术报告通知】：温晓青 (Xiaoqing WEN) , 《低功耗大规模集成电路测试的机遇与挑战》

发布人: 成元庆

发布时间: 2018-03-26

时间地点: 2018年3月29日 2: 30PM, F529

报告人: 温晓青 (Xiaoqing WEN)



1986年获清华大学计算机科学与技术学士学位, 1990年获日本广岛大学信息工程硕士学位, 1993年获日本大阪大学应用物理博士学位。曾任日本秋田大学讲师和美国威斯康辛大学麦迪逊校访问学者, 并在美国SynTest Technologies, Inc. 从事芯片测试软件研发。2004年任日本九州工业大学副教授, 2007年升任教授, 2013年创建高可靠性集成系统研究中心 (DISC) 并任主任, 现任日本九州工业大学信息创成系主任。研究方向为芯片可测性设计, 测试生成, 故障诊断。已发表170余篇学术论文, 编著2本学术专著, 拥有41项美国专利及14项日本专利, 获2008年度IEICE-ISS学会最佳论文奖并于2012年当选为IEEE Fellow。现担任IEEE TCAD, IEEE TVLSI, JETTA等学术杂志的编委以及众多国际会议的程序委员。

个人网页: <http://aries3a.cse.kyutech.ac.jp/~wen/>

报告简介:

**Power-Aware LSI Testing
Challenges and Strategies**

Xiaoqing Wen
Kyushu Institute of Technology
Iizuka, Japan

Power has become the major differentiating factor for such advanced LSI applications as wearable and IoT devices, which require extremely low functional power consumption to be realized by comprehensive and often proprietary power management. Testing of such LSI circuits are becoming increasingly difficult, leading to unacceptably low test quality and unbearably high test cost. This represents a huge risk to the smooth deployment of wearable and IoT devices. This talk will highlight the challenges caused by power-related issues in LSI testing and identify major strategies to develop next-generation power-aware test techniques.

友情链接：[学院老网站](#) [北航校网站](#) [财务处网站](#) [北航邮箱](#)

版权所有：北京航空航天大学电子信息工程学院 [联系管理员](#)